

Времена жизни неосновных носителей заряда в полупроводниках с учетом Оже-процессов на локализованных состояниях

Opotski, Aleksei Машинное проектирование электронных устройств и систем 1988 / с. 134-148

К вопросу об Оже-рекомбинации в полупроводниках

Opotski, Aleksei Измерение и моделирование в электронике 1987 / с. 101-113

Численное моделирование процессов в полупроводниковых структурах с учетом рекомбинации через многозарядные центры

Velmore, Enn; Opotski, Aleksei; Udal, Andres Численные методы и средства проектирования и испытания элементов РЭА : тезисы докладов. Том 1 1987 / с. 131-134 : ил https://www.ester.ee/record=b1273986*est

Электротехника и автоматика

Kukk, Vello; Tamm, Uljas; Pikkov, Otto; Min, Mart; Velmore, Enn; Udal, Andres; Nurste, Ivar; Freidin, Boris; Rang, Toomas; Opotski, Aleksei; Laansoo, Ants; Männama, Vello; Järvalt, Aldur; Gurjanov, Boris; Lavrov, Mihhail; Belkina, I.I.; Plakk, Paul; Plakk, Peeter; Plakk, T. 1987 https://www.ester.ee/record=b1224910*est

Электротехника и автоматика

Rüstern, Ennu; Keevallik, Andres; Kruus, Margus; Salum, Kaja; Berkman, Boriss; Tammemäe, Kalle; Alango, Villem; Kont, Toomas; Ubar, Raimund-Johannes; Lohuaru, Tõnu; Štraube, B.; Elst, G.; Bombik, B.; Viies, Vladimir; Gallai, S.; Rang, Toomas; Laansoo, Ants; Männama, Vello; Pikkov, Otto; Gurjanov, Boris; Opotski, Aleksei; Velmore, Enn 1988 https://www.ester.ee/record=b1256708*est